

ICS 29.045  
H 80



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6621—2009  
代替 GB/T 6621—1995

GB/T 6621—2009

## 硅片表面平整度测试方法

Testing methods for surface flatness of silicon slices

中华人民共和国  
国家标准  
硅片表面平整度测试方法  
GB/T 6621—2009

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

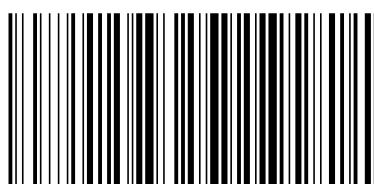
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字  
2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷

\*

书号：155066·1-39585 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533



GB/T 6621-2009

2009-10-30 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

